

2020年2月21日

各位

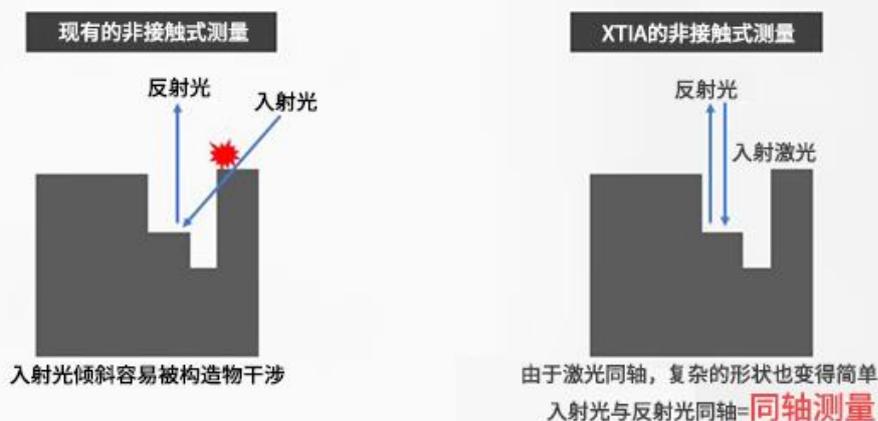
双日株式会社

双日出资大型 3D 形状测量公司 XTIA

株式会社 XTIA（公司原名：株式会社光梳，以下简称“XTIA”）是全球唯一一家应用诺贝尔物理学奖获奖技术“光学频率梳”成功商品化的技术开发企业。双日株式会社（以下简称“双日”）接受该公司的新发股预定权，以利用该技术在国内外共同推广新服务和新业务为目的，投资该公司。

使用“世界上精度最高的尺子”原理的 XTIA 光学频率梳-非接触式三维形状测量仪自 2016 年推出以来，被日本国内绝大多数汽车制造商购入，目前正在引入批量生产线。(富士经济集团调查结果显示，2017-2019 年连续 3 年稳居在线汽车零部件检测市场占有率首位)

超越激光3D测量极限的技术



【非接触式三维形状测量仪特点】

双日与日本国内最大的汽车零部件品质检测公司 Green Tec 合作，收购了美国大型品质检测服务供应商 Stratosphere Quality LLC (*)，为汽车、汽车零部件厂家等客户提供服务，致力于品质检测事业。通过本次投资，利用光学频率梳技术，使用非接触式 3D 形状测量传感器开启品质检测的外包业务，将目前为止难以实现的自动化检测成为可能，并将最终用户的初期投入负担最小化。

(*) 请参考 2017 年 7 月 6 日的公司新闻

双日利用具有压倒性优势的光学频率梳技术在日本国内外广泛开展外包检测业务和其他服务，我们的目标是扩大本公司的品质检测业务，并为检测过程自动化的普及做出贡献。

(参考资料)

【XTIA 公司概况】

公司名称	株式会社 XTIA
成立时间	2002 年 4 月
地址	東京都千代田区神田三崎町 3-6-12 神田三崎町大厦 3F
代表人	代表董事社长 八木 贵郎
主要业务内容	光学频率梳发生器及其应用等相关设备的开发和销售